

EVAFLEX® 5-VS

Part No. 20535-0**E-02

Product Specification

Qualification Test Report No. TR-12108

6	S22107	March 11, 2022	K.Hashimoto	M.Muro	H.Ikari		
5	S21647	November 29, 2021	9, 2021 K.Hashimoto M.Mur		H.Ikari		
4	S18024	January 16, 2018	H.Aoki T.Kurachi		Y.Shimada		
3	S15476	October 13, 2015	T.Tanigawa	T.Kurachi	J.Tateishi		
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by		

EVAFLEX 5-VS Product Specification

1. 適応範囲

本規格は、コンタクトピッチ 0.5mm の基板対 SHIELD FFC コネクタである EVAFLEX 5-VS コネクタの性能と試験条件について 規定する。

2. 製品名称及び製品型番

2.1 製品名称

EVAFLEX 5-VS

2.2 製品型番

20535-0**E-02

3. 定格

3.1 使用条件

電流: 0.3A AC/DC (1pin 当たり)

※0.5A (1pin 当たり) を通電させる場合は、コネクタ全体の総電流値が 15.0A 以下となる事。

電圧: 200V AC/DC (1pin 当たり) 使用温度:233~358K(-40℃~85℃)

(通電による温度上昇含む)

使用湿度:85% max

3.2 保管条件

保管温度:248~333K(-25℃~60℃) 保管湿度: 85% max.(結露無きこと)

4. 試験及び性能

試験条件

本試験の初期とは、出荷時の状態のことである。

特に指定のない限り、測定と試験は、MIL-STD-202Gに基づき以下の条件で行う。

温度 ··· 288K~308K (15℃~35℃)

気圧 ... 866hPa \sim 1066hPa (650mmHg \sim 800mmHg)

相対湿度 ··· 45∼75%R.H.

4.1.電気的性能/Electrical Performance

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
1.	接触抵抗	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、開回路電圧 20mV DC 以下、短絡電流 1mA DC 以下で 4 端子法にて図 1 に示す区間の接触抵抗を測定する。 MIL-STD-202G 試験法 307 に準拠。	初期値: 60mΩ 以下 変化量⊿R: 40mΩ以下
2.	絶縁抵抗	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続 させ、隣接する端子間に DC100V を印加し、測定する。 MIL-STD-202G 試験法 302 に準拠。	100ΜΩ以上
3.	耐電圧	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、隣接する端子間に AC250V (実効値) を一分間印加する。 MIL-STD-202G 試験法 301 に準拠。	沿面放電、空中放電、絶縁破壊 等の異常無きこと。
4.	温度上昇	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続 させ、各端子に定格電流を通電させ周囲温度上昇を測定 する。	温度上昇/Temperature rise ΔT:30K(30℃)MAX.
5.	差動インピーダンス	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続 させ、差動 TDR: ライズタイム 250psec.にて 差動インピーダンスを測定する。	100±10Ω

4.2.機械的性能/Mechanical Performance

1/20 /W-	TERD/ PICCHAINCALL	0.10111141100	
No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
1.	挿抜力	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続	挿入力
		させ、その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に	0.6N×n 以下
		平行に毎分 25±3mm の速度で、初期及び 30 回目の	<u>抜去力</u>
		挿入抜去力を測定する。	0.1N×n 以上
			※n=極数
2.	耐久性	テスト基板にコネクタを半田付けする。その後、試料を挿抜試験	[接触抵抗]
		機に取り付け、FFCを嵌合軸に平行に毎分 25±3mm の速度	4.1.1 を満足する事。
		で、30 回挿入抜去を行う。	
3.	端子保持力	コネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度で	0.3N / Pin 以上
		端子の軸に沿って、端子に圧入と逆方向の荷重を加え、端子が	
		コネクタより抜ける時の荷重を測定する。	
4.	FFC 保持力	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を嵌合	0.3N×n + 6.0N以上
		させた後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に導体	※n=極数
		を引っ張る。	
			LOCK 部外観に異常なき事。

4.2.機械的性能/Mechanical Performance

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
5.	耐振動性	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、振動試験機に取り付け、以下の振動を加える。 試験中 100mA DC の電流を流して電気的瞬断を確認する。 MIL-STD-202G 試験法 201A に準拠。 周波数 : 10Hz→55Hz→10Hz/約1分 方向 : 3つの互いに直角な方向 全振幅 : 1.52mm 掃引時間:各方向に2時間、計6時間	[接触抵抗] 4.1.1 を満足する事。 [瞬断] 試験中、1µs を超える電気的 瞬断の無き事。 [外観] 機能を損なう異常無き事
6.	耐衝撃性	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、衝撃試験機に取り付け、以下の衝撃を加える。 試験中 100mA DCの電流を流して電気的瞬断を確認する。 MIL-STD-202G 試験法 213B 試験条件 A に準拠。 最大加速度 : 50G 標準持続時間: 11msec. 波形 : 半波正弦波 試験回数 : 各方向に3回(合計18回)	[接触抵抗] 4.1.1 を満足する事。 [瞬断] 試験中、1µs を超える電気的 瞬断の無き事。 [外観] 機能を損なう異常無き事

4.3.耐環境性能/Environmental Performance

	東苑住版/ Litvironnicital renormance									
No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications							
1.	熱衝撃	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202G 試験法 107G 試験条件 A に準拠。 温度 : 218K(-55℃): 30分→358K(85℃): 30分 移動時間: 5分 MAX. 回数 : 5 サイクル	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事 [絶縁抵抗] 4.1.2.を満足する事 [耐電圧] 4.1.3.を満足する事。 「外観]							
2.	高温寿命	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続	機能を損なう異常無き事							
		させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202G 試験法 108A 試験条件 B に準拠。 温度: 358±2K (85±2℃) 期間: 250時間	4.1.1.を満足する事 [外観] 機能を損なう異常無き事							
3.	湿度(定常状態)	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202G 試験法 103B 試験条件 A に準拠。 温度: 313±2K (40±2℃) 湿度: 90~95%RH 期間: 240時間	 [接触抵抗] 4.1.1.を満足する事 [絶縁抵抗] 4.1.2.を満足する事 [耐電圧] 4.1.3.を満足する事。 [外観] 機能を損なう異常無き事 							

EVAFLEX 5-VS Product Specification

4.3.耐環境性能/Environmental Performance

No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications
4.	湿度(サイクリング)	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202G 試験法 106G に準拠。 温度: 263~338K (-10~65℃) 湿度: 90~98%RH 期間: 10 サイクル (240 時間)	[接触抵抗]4.1.1.を満足する事[絶縁抵抗]4.1.2.を満足する事[耐電圧]4.1.3.を満足する事。[外観]機能を損なう異常無き事
5.	塩水噴霧	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。 MIL-STD-202G 試験法 101E 試験条件 B に準拠。 温度 : 308±2K (35±2℃) 塩水濃度:5±1%[重量比] 期間 : 48 時間	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事 [外観] 機能を損なう異常無き事
6.	硫化水素ガス	テスト基板にコネクタを半田付けし、適合する導体を接続させ、以下の環境条件に暴露する。 温度 : 313±2K (40±2℃) 相対湿度: 80±5%RH ガス : H ₂ S 3±1ppm 期間 : 96 時間	[接触抵抗] 4.1.1.を満足する事 [外観] 機能を損なう異常無き事

4.4.その他 (Others)

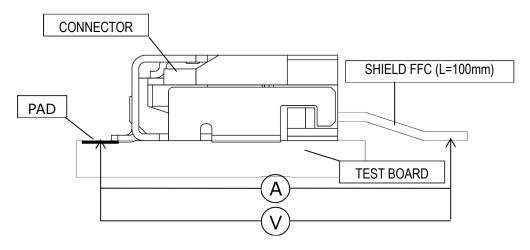
	(Others)										
No	項目 / Items	試験条件 / Test Conditions	規格 / Specifications								
1.	半田付け性	端子の半田付け部を 518±5K (245±5℃)の半田槽内に 5	浸した面線の 95%以上に半田が								
		±0.5 秒間浸す。フラックスは、RMA 型または R 型を使用し、5~	むらなく付着すること。								
		10 秒間浸漬するものとする。									
2.	半田耐熱性	<リフロー> リフロー部	機能を損なう異常無き事								
		予熱部									
		423~453K (150~180℃): 60~120 秒									
		リフロー回数は2回以内。									
		リフロー温度プロファイル参照。									
		ノマア付けさい									
		<こて付け法> 半田こて先温度:663K (390℃)									
		こて先当て時間:3秒									
		加熱回数:2回									
		加热因数:2日									
Peak : 523~527K (250~255℃) 503K (230℃) 2 453K (180℃) 423K (150℃) Pre Heating Zone 60~120sec. Soldering Zone 20~40sec.											
		Heating time									
	cagc										

5. 試験順序と試料数

表 1 試験順序と試料数

=+FAT5 C	グループ													
試験項目	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	Р
接触抵抗			2,6			1,3, 5	1,3	1,3	1,5	1,5, 7	1,3	1,3		
絶縁抵抗									2,6	2,8				
耐電圧									3,7	3,9				
温度上昇	1													
差動インピーダンス		1												
挿入力			1,5											
抜去力			3,7											
耐久性			4							4,10 cyc				
端子保持力				1										
FFC 保持力					1									
振動						2								
衝撃						4								
熱衝撃							2							
高温寿命								2						
湿度(定常状態)									4					
湿度(サイクリング)										6				
塩水噴霧											2			
硫化水素ガス												2		
半田付け性													1	
半田耐熱性														1
試料数	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10

[※] グループ表中の番号は、試験順序を示す。



接触抵抗 = R_{AB} - (FPC / FFC 100mm 導体抵抗) <u>図 1 接触抵抗測定</u>

6. 推奨メタルマスク

推奨マスク厚と開口寸法に関しては、図面参照のこと

7. コネクタ取り扱いの注意

本コネクタの取り扱いに関しては、取り扱い説明書: HIM-12003を参照願います。